INTERNATIONAL STANDARD

ISO 20263

First edition
2017-11

Microbeam analysis — Analytical electron microscopy — Method for the determination of interface position in the cross-sectional image of the layered materials

Analyse par microfaisceaux — Microscopie électronique analytique — Méthode de détermination de la position d'interface dans l'image de coupe transversale des matériaux en couches

Reference number
ISO 20263:2017(E)

ISO copyright office
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org

Contents

Page